

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich .....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Prüflinge .....	6
5 Kennzeichnung und Dokumentation .....	6
6 Prüfung .....	6
7 Annahmekriterien .....	7
8 Größere sichtbare Schäden .....	7
9 Bericht.....	7
10 Änderungen .....	7
11 Prüfablauf und Prüfverfahren .....	7
11.1 Sichtprüfung (MQT 01).....	7
11.2 Bestimmung der höchsten Leistung (MQT 02) .....	7
11.3 Isolationsprüfung (MQT 03).....	7
11.4 Messung der Temperaturkoeffizienten (MQT 04) .....	7
11.5 Leistung bei Normprüfbedingungen (MQT 06.1).....	7
11.6 Leistung bei geringer Bestrahlungsstärke (MQT 07) .....	7
11.7 Bewitterungsprüfung (MQT 08).....	7
11.8 Hot-Spot-Dauerprüfung (MQT 09).....	8
11.8.1 Zweck .....	8
11.8.2 Hot-Spot-Effekt.....	8
11.8.3 Einteilung der Zellenverschaltungen .....	8
11.8.4 Prüfmittel .....	8
11.8.5 Durchführung.....	8
11.8.6 Schlussmessungen .....	8
11.8.7 Anforderungen.....	8
11.9 UV-Vorbehandlungsprüfung (MQT 10) .....	8
11.10 Temperaturwechselprüfung (MQT 11) .....	8
11.11 Feuchte-Frost-Prüfung (MQT 12).....	8
11.12 Prüfung mit feuchter Wärme (MQT 13).....	8
11.13 Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Anschlüsse (MQT 14).....	9
11.14 Prüfung des Isolationswiderstandes unter Benässung (MQT 15).....	9
11.15 Statische mechanische Belastungsprüfung (MQT 16).....	9
11.16 Hagelprüfung (MQT 17).....	9
11.17 Prüfung der Bypass-Diode (MQT 18).....	9
11.18 Stabilisierung (MQT 19).....	9
11.18.1 Festlegung des Stabilisierungskriteriums.....	9
11.18.2 Lichtinduziertes Stabilisierungsverfahren.....	9

	Seite
11.18.3 Weitere Stabilisierungsverfahren .....	10
11.18.4 Erststabilisierung (MQT 19.1) .....	10
11.18.5 Endstabilisierung (MQT 19.2) .....	10
11.19 Zyklische (dynamische) mechanische Belastungsprüfung (MQT 20).....	10
11.20 Prüfung auf spannungsinduzierte Degradation (MQT 21) .....	10
11.21 Biegeprüfung (MQT 22) .....	10
11.22 Prüfung auf durch Licht und erhöhte Temperaturen verursachte Degradation (LeTID) (MQT 23).....	11